

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15127-01-02 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 04.05.2023

Ausstellungsdatum: 04.05.2023

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-K-15127-01-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

Kistler Instrumente Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Umberto-Nobile-Str. 14, 71063 Sindelfingen

Das Kalibrierlaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Kalibrierlaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15127-01-02

mit dem weiteren Standort

Brunhamstraße 21, 81249 München

Kalibrierungen in den Bereichen:

Dimensionelle Messgrößen

Länge

- **Längenmessmittel**

Elektrische Messgrößen

Gleichstrom- und Niederfrequenzmessgrößen

- **Gleichspannung**
- **Gleichstrom**
- **Gleichstromwiderstand**

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15127-01-02

Permanentes Laboratorium, Standort Sindelfingen

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Länge Wegaufnehmer	0 mm bis 200 mm	CD30037:2023-01	25 µm	analoge und digitale Sensoren
	> 200 mm bis 600 mm		50 µm	
	> 600 mm bis 850 mm		90 µm	

Permanentes Laboratorium, Standort München

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Gleichspannung Gleichspannungsquellen	0 V bis 1 mV		4,6 µV	Direktmessung
	> 1 mV bis 10 mV		5,3 µV	
	> 10 mV bis 100 mV		11 µV	
	> 100 mV bis 1 V		44 µV	
	> 1 V bis 10 V		0,41 mV	
	> 10 V bis 20 V		1,7 mV	
	> 20 V bis 100 V		6,0 mV	
	> 100 V bis 1000 V		60 mV	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15127-01-02

Permanentes Laboratorium, Standort München

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Gleichspannung Messgeräte	0 V bis 450 μ V		0,62 μ V	
	>450 μ V bis 3 mV		1,1 μ V	
	>3 mV bis 4,5 mV		1,6 μ V	
	>4,5 mV bis 10 mV		3,9 μ V	
	>10 mV bis 30 mV		4,9 μ V	
	>30 mV bis 45 mV		5,6 μ V	
	>45 mV bis 300 mV		25 μ V	
	>300 mV bis 450 mV		41 μ V	
	>450 mV bis 3 V		0,25 mV	
	>3 V bis 4,5 V		0,43 mV	
	>4,5 V bis 30 V		2,5 mV	
Gleichstromstärke Quellen	0 A bis 100 μ A		1,0 μ A	
	>100 μ A bis 1 mA		1,6 μ A	
	>1 mA bis 10 mA		7,2 μ A	
	>10 mA bis 100 mA		0,16 mA	
	>100 mA bis 1 A		1,1 mA	
	>1 A bis 3 A		4,5 mA	
	1 mA bis 20 mA		$1,5 \cdot 10^{-4}$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15127-01-02

Permanentes Laboratorium, Standort München

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Gleichstromwiderstand Widerstände	0 Ω bis 100 mΩ		0,10 mΩ	
	>100 mΩ bis 1 Ω		0,14 mΩ	
	>1 Ω bis 10 Ω		0,77 mΩ	
	>10 Ω bis 100 Ω		7,6 mΩ	
	>100 Ω bis 250 Ω		21 mΩ	
	>250 Ω bis 660 Ω		51 mΩ	
	>660 Ω bis 1 kΩ		76 mΩ	
	>1 kΩ bis 10 kΩ		0,76 Ω	
	>10 kΩ bis 100 kΩ		9,1 Ω	
	>100 kΩ bis 1 MΩ		91 Ω	

Verwendete Abkürzungen:

CD300xxx Kalibrierverfahren der Kistler Instrumente GmbH
 CMC Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmöglichkeiten)